

三箱混合型冷热冲击试验箱

Three Zone Thermal Shock Test Chambers



专利号: ZL201120542783.8



TS系列 三箱混合型冷热冲击试验箱

冷热冲击试验箱不需要使用液态气体(LN₂, LCO₂)辅助降温,待测物完全静止测试方式是当前电子产品测试用、研究用、以及半导体生产线大量筛选用,可大量节省耗材测试费用。操作快捷、高信赖,是本公司经多年潜心、倾力研究,开发高性能试验设备,提供您长期可靠的测试工具。

- 试料槽完全静止,可由测试孔外加负载配线。
- 蓄热方式可避免使用者职业伤害。(注:液态气体所产生废气,吸入肺部致使肺部气量减少,而产生工作倦怠,集中力降低)。
- 采用10.4英寸大型触控式彩色液晶显示人机介面控制器,操作简单、学习容易。运行状态一目了然。用户可保存1000个自行编辑的试验程序。
- 温度制御精度高,全部采用PID自动演算制御。误差低,风速高,试样暴露均匀。
- 可选择始动位置,高温或低温开始循环,根据复归时间要求,自动设定预冷,预热温度。
- 控制机器人界面友好,运转状态显示,程序设定、故障排除等功能齐全。
- 调整机器的工作状态至最佳。
- 具有预约起动功能。
- 可设定循环次数及自动除霜。
- 可选择二槽或三槽循环。
- 省耗节能,低噪音设计。

筛选电子元器件初期故障的最佳助手

型 号		TSL-80A	TSL-150A	TSL-225W	TSL-408W
		TSU-80W	TSU-150W	TSU-225W	TSU-408W
		TSS-80W	TSS-150W	TSS-225W	TSS-408W
标称内容积(升)		80	150	225	408
试验方式		气动风门切换2温室或3温室方式			
性 能	高温室	预热温度范围	+60~+200°C		
		升温速率※1	+60→+200°C≤20分钟		
	低温室	预冷温度范围	-78-0°C		
		降温速率※1	+20→-75°C≤80分钟		
	试验室	温度偏差	±2°C		
		温度范围	TSL: (+60→+125)°C→(-40~-10)°C; TSU: (+60~+150)°C~(-55~-10)°C; TSS: (+60~+150)°C~(-65~-10)°C		
温度恢复时间※2		5分钟以内			
试样搁架承载能力		30kg			
试样重量		7.5kg	7.5kg	10kg	10kg
内部尺寸(mm)	W	500	600	750	850
	H	400	500	500	600
	D	400	500	600	800
外形尺寸(mm)※4	W	1460	1560	1710	1880
	H	1840	1940	1940	2040
	D	1500	1600	1700	1900

※1温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能。

※2恢复条件:室温为+25°C和循环水温为+25°C,试样是塑料封装集成电路。(均布)